

1. Record Nr.	UNISA996280709603316
Titolo	2018 IEEE International Conference on Microelectronic Test Structures : 19-22 March 2018, Austin, TX, USA // IEEE Electron Devices Society
Pubbl/distr/stampa	Piscataway, New Jersey : , : Institute of Electrical and Electronics Engineers, , 2018
ISBN	1-5386-5071-1
Descrizione fisica	1 online resource (78 pages)
Disciplina	621.381548
Soggetti	Integrated circuits - Testing Semiconductors - Testing Electronic apparatus and appliances - Testing
Lingua di pubblicazione	Inglese
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia